

Table of Contents

OverView 1

Specifications 1

OverView 1

OverView

Specifications



OverView

- IIM-3000可以检测300mm硅晶圆上的各类缺陷，可检测的缺陷类型如下：内部气孔、凸起、通孔。
- 先进的缺陷测量和分级算法，可以高速检测各类型的硅晶圆□N, P-, P+, P++□□
- IIM-3000采用专用控制器，可提供最佳的控制性能，以及相当简便的设置和维护工作。
- 卓越的定制系统和软件，使IIM-3000可提供稳定可靠的检测结果。

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=cn:equipment:iim3000:20_overview&rev=1587708096

Last update: 2024/07/08 18:22